

# inVia显微拉曼与原子力显微镜 (AFM) 联用

雷尼绍拉曼-AFM联用仪器使材料在亚微米尺度上的化学和结构的性能得以描绘



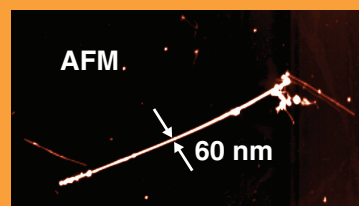
雷尼绍inVia显微拉曼光谱仪能与多个厂家/型号的AFM联用，包括Bruker、Nanonics和NT-MDT的多种AFM。

## 快速评估材料的质量和性能：

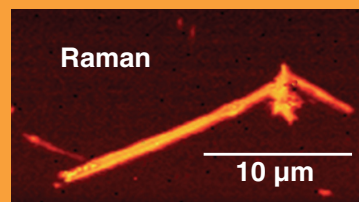
- 来自inVia的化学认证和结构
- 来自AFM的形貌和力学的特性
- 同时采集的拉曼和AFM数据保证图像的相关性
- 同一平台的解决方案提供可信度、可靠性和使用方便

## 拓展分析能力而没有损失各自性能：

- 联用仪器的软件使用极其方便
- 高效直接耦合光路（无需光纤）充分保障通光效率，极大缩短拉曼测量时间
- 模块化结构设计，不同测试功能完美集成
- 支持针尖增强拉曼散射 (TERS) 测试（部分AFM型号）



直径60纳米的硅纳米管图像：由AFM和拉曼同时采集。



样品提供：  
Prof M Kuball, University of Bristol, UK, and  
Prof J Redwing, Penn State University, USA.

香港 T +852 2753 0638 F +852 2756 8786 E hongkong@renishaw.com  
上海 T +86 21 6180 6416 F +86 21 6180 6418 E shanghai@renishaw.com  
北京 T +86 10 5108 8282 F +86 10 8448 1528 E beijing@renishaw.com  
广州 T +86 20 8550 9485 F +86 20 8550 9458 E guangzhou@renishaw.com  
成都 T +86 28 8652 8671 F +86 28 8652 8730 E chengdu@renishaw.com  
重庆 T +86 23 6865 6997 F +86 23 6810 0778 E chongqing@renishaw.com

沈阳 T +86 24 2334 1900 F +86 24 2334 1500 E shenyang@renishaw.com  
西安 T +86 29 8833 7292 F +86 29 8833 7249 E xian@renishaw.com  
青岛 T +86 532 8909 0811 F +86 532 8909 0810 E qingdao@renishaw.com  
深圳 T +86 755 3369 2648 F +86 755 3369 2649 E shenzhen@renishaw.com  
苏州 T +86 512 8686 5539 F +86 512 8686 5569 E suzhou@renishaw.com

[www.renishaw.com.cn](http://www.renishaw.com.cn)